

2号炉 放射化汚染, 二次的な汚染の工程について(更新)

令和3年2月26日
中国電力株式会社

項目		1月		2月		3月	
		前半	後半	前半	後半	前半	後半
放射化汚染	サンプリングの実施 場所: 1号炉タービン建物3階 採取: ポリ瓶1本	準備※1	2号炉からのサンプリング 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×1個 低圧内部車室入口側×1個	(完了)			
	分析方法検討	手順書案作成	検出限界値検討※2 予備サンプル(低圧ダイヤフラム)試験※3	(完了)			
	分析の実施		2号炉の分析※4 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×1個(実施中) 低圧内部車室入口側×1個(完了)				
二次的な汚染	サンプリングの実施 場所: 1号炉タービン建物3階 採取: ポリ瓶1本	準備※1	2号炉からのサンプリング※5 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×2個(除染前後) 低圧内部車室入口側×2個(除染前後)	(完了)			
	分析の実施		2号炉の分析※6 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×2個(除染前後)(除染後のみ実施中) 低圧内部車室入口側×2個(除染前後)(完了)				
表面汚染密度分布			低圧ダイヤフラム: 軸方向及び周方向の測定 低圧内部車室: 軸方向及び周方向の測定	(完了)			
基本ロジック(エビデンス)						提出▽	
不確かさ等	GMサーベイメータの不確かさ 測定単位, 評価単位	JISの不確かさ調査					
		測定, 評価単位の現場調査等			記載案の検討		

※1: 資機材(切断装置等), 消耗品(ポリ瓶, 養生シート等)の準備, 発電所内のQMS手順書に基づく承認手続き(安全対策関係の作業承認等) (完了)

※2: 予備サンプルを用いてCo-60の検出限界値について1/33を達成できる見込みが得られた(完了)。1/66は分析しながら検討する。

※3: 酸により予備サンプルを溶解~Ge半導体検出器測定を行う。(完了)

※4: 検討した手順書により分析を実施する。1サンプルあたり溶解(5日程度), Ge測定(2日程度)

※5: サンプリング: 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×2個, 低圧内部車室入口側×1個(完了)

プラスト除染装置による除染: 除染装置のメンテナンス(5日程度), 低圧ダイヤフラム第7段噴口部×1個, 低圧内部車室入口側×1個の除染(10日程度)(完了)